

Jandel Multi-height Probe

簡介:

1. Probe 下針高度可隨 SAMPLE 的厚薄調整。可量 WAFER 與 INGOT。
2. 壓桿設計有量測切換開關，避免下針時突然的電流影響阻值的正確性。
3. SAMPLE 量測縱深可達 10 英寸。
4. 量測範圍可從 0.001~1000000 ohm/sq。
5. RM3 附有 100 ohm 的電阻器可供校驗與精度測試。
6. RM3 有自我校正功能。
7. 備有 Rs-232、USB 與軟體可供輸出到電腦。
8. 本機型不含針頭，需另外加購。

